

(12) NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES
PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG

(19) Weltorganisation für geistiges
Eigentum

Internationales Büro

(43) Internationales
Veröffentlichungsdatum
14. Juni 2012 (14.06.2012)



(10) Internationale Veröffentlichungsnummer
WO 2012/076189 A1

(51) Internationale Patentklassifikation:

G01N 21/956 (2006.01) H05K 13/04 (2006.01)
H05K 13/08 (2006.01)

(21) Internationales Aktenzeichen: PCT/EP2011/006233

(22) Internationales Anmeldedatum:
9. Dezember 2011 (09.12.2011)

(25) Einreichungssprache: Deutsch

(26) Veröffentlichungssprache: Deutsch

(30) Angaben zur Priorität:
10 2010 053 912.0
9. Dezember 2010 (09.12.2010) DE

(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme
von US): MUEHLBAUER AG [DE/DE]; Josef-
Muehlbauer-Platz 1, 93426 Roding (DE).

(72) Erfinder; und

(75) Erfinder/Anmelder (nur für US): MIEHLICH, Rainer
[DE/DE]; Kolpingring 18, 82041 Oberhaching (DE).

PRAKAPENKA, Uladimir [BY/DE]; Josef-Muehlbauer-
Platz 1, 93426 Roding (DE).

(74) Anwalt: SCHMIDT, Steffen, J.; Wuesthoff & Wuesthoff,
Schweigerstrasse 2, 81541 München (DE).

(81) Bestimmungsstaaten (soweit nicht anders angegeben, für
jede verfügbare nationale Schutzrechtsart): AE, AG, AL,
AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BR, BW, BY,
BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM,
DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT,
HN, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KM, KN, KP,
KR, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LY, MA, MD,
ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI,
NO, NZ, OM, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW,
SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, ST, SV, SY, TH, TJ, TM,
TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM,
ZW.

(84) Bestimmungsstaaten (soweit nicht anders angegeben, für
jede verfügbare regionale Schutzrechtsart): ARIPO (BW,
GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, SZ,

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

(54) Title: OPTICAL EXAMINATION DEVICE AND OPTICAL EXAMINATION METHOD

(54) Bezeichnung : OPTISCHE UNTERSUCHUNGSEINRICHTUNG UND OPTISCHES UNTERSUCHungsverfahren

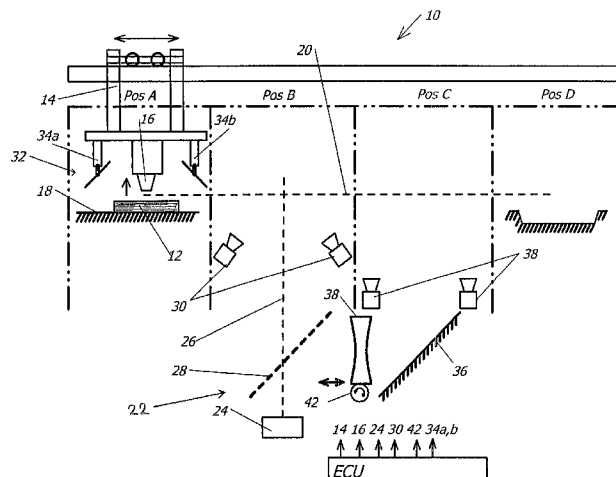


Fig 1

(57) Abstract: The invention relates to an optical examination device (10) for a component (12), having a first and a second examination region. Said device has an imaging unit (22) for optically recording lateral surfaces of a component. Said imaging unit is designed to record an image of one of the lateral surfaces of a component in the first examination region (Pos. B), and to record an image of several of the lateral surfaces of a component in the second examination region (Pos. C). Said examination device has a component conveyor (14). The component conveyor has a holding device (16) for a component. Said conveyor is designed to convey a held component along a component path (20). The component path can lead to the first examination region, from the first examination region to the second examination region, and away from the second examination region. The imaging unit has an image acquisition device (24), which is designed to be directed at a lateral surface of a component in the first examination region, and an image in-coupling unit (28), which is designed to couple an image of several of the lateral surfaces of a component from the second examination region into the image acquisition device. A first image deflection device (32) can be moved together with the component conveyor. The component conveyor is designed to substantially continuously convey a component along the component path.

(57) Zusammenfassung:

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]



WO 2012/076189 A1